19日本国特許庁(JP)

⑩特許出 雕公告

許 公 報(B2) ⑫ 特

昭63-13226

@Int_Cl.4

識別記号

庁内整理番号

❷❷公告 昭和63年(1988)3月24日

G 06 F 15/62

460

6615-5B

発明の数 1 (全7頁)

匈発明の名称

指紋照合装置

②特 顧 昭54-98966 ❸公 開 昭56-24675

田野 願 昭54(1979)8月2日 砂昭56(1981)3月9日

⑫発 明 浅 者

紕

東京都港区芝五丁目33番1号 日本電気株式会社内

東京都港区芝5丁目33番1号

日本電気株式会社 ①出 願 人

20代 理 弁理士 内 原 굠 人

1

審査官 H 村 征

切特許請求の範囲

1 探索すべき指紋特徴と、少なくとも一つ以上 のフアイル指紋特徴とを照合する装置において、 前記各指紋特徴の構成要素である特徴点群に対 る近傍特徴点をリレーション関係を用いて再構成 するリレーション連結部と、再構成された指紋特 徴を保持する探索特徴記憶部及びフアイル特徴記 憶と、前記特徴記憶に保持された各特徴点データ を順次読出し、位置、方向、リレーションを比較 10 して対となる特徴点群を検出する対検査部と、前 記対検査部で検出された対特徴点群を保持する対 特徴記憶部と、前記対特徴記憶部に保持された対 特徴点群と前記探索特徴記憶部及びフアイル特徴 から指紋の一致性を判定する照合判定部からな り、近傍特徴点間の降線数を特徴量とするリレー ションを含む指紋特徴によって対となる特徴点群 を検出することを特徴とする指紋照合装置。

発明の詳細な説明

この発明は、指紋等の縞状パターンから構成さ れた紋様の同一性を、その紋様特徴によつて照合 する装置に関するものである。

従来、指紋の照合は指紋を構成する隆線紋様の 点(端点)M,mo,mi及び分岐又は合流する点 (分岐点) m, m,を特徴点とし、その位置X, Y及び方向Dをコード化したものを特徴として特 開昭50-10525号及び特開昭53-12235号公報に記

載されている如く、これら特徴点の配置関係を検 査することにより行われている。しかしながら、 探索されるべき指紋(以後探索指紋と呼ぶ)と、 多数の照会されるべきフアイル指紋(以後フアイ し、特徴点群各点の局所座標系の各象限に存在す 5 ル指紋と呼ぶ)との特徴点の照合を行なう際に、 上記探索指紋特徴点とフアイル指紋特徴点の全て あるいは、位置X,Y及び方向Dを了じめ設定さ れた変動内に限定した組合せで照合させる従来の 方法では次の点で問題がある。

2

犯罪現場に残された遺留指紋のように、採取さ れる指紋印象が部分的であり特徴点が少数の場 合、多量のフアイル指紋と照合させると、類似指 紋との分離が困難となる。

遺留指紋には押捺時の紋様変形が大きく、これ 記憶部に保持されている再構成された指紋特徴と 15 をX, Y, Dの変差で一致させようとする大きな 変動を許容する閾値を設定せざるを得ないが、こ の時類似指紋との分離が増々劣化する。このよう に低品質の押捺指紋あるいは遺留指紋を、多数の フアイル指紋の照合に際して、特徴点の位置X, 20 Y及び方向Dのみの照合では困難な場合が多い。 一方、現在指紋鑑識官が指紋の照合鑑定を行つて いる方式の重要な特徴の一つに各特徴点間の隆線 **数がある。例えば第1図を参照して、注目する1** 特徴点Mの方向Dによる局所座標系x, yに於け 特徴点、即ち第1図において、隆線Kの端切れる 25 る各象限の最近傍特徴点mo, mi, m2, m3との それぞれの隆線数ro, rı, r2, rs(これらを以後リ レーションと呼ぶ)を新たな特徴として用いるこ とにより照合の精度が格段に向上される。一例を あげれば、第2図に示すように特徴点Maと特徴

点Moを有する二つの指紋は、その特徴点Moo M。を中心として位置及び方向が相似関係にあつ ても、それぞれのリレーションを検査すれば異な る指紋であることが判定される。さらに、1特徴 点Mを中心とする一定領域内の他の特徴点数によ 5 つて求められる集密量Cは、特徴点Mに於ける集 密性を表わしており、リレーション抽出時に副次 的に容易に求められるとともに、リレーションの 擬似的な代表値の性格を有している。即ちro~rs が小さいとき集密量 Cは大きくなる場合が多い。 10 ら構成される。 また集密量では、これが異なる特徴点は「対」と はなり得ないという意味から「対」特徴検査の判 定量として採用できる。

リレーション特徴及び集密量は、位置X,Y及 る量であつて照合時に位置X、Y及び方向Dの一 致検出と独立に検査することができる。

上記リレーションが指紋紋様パターンが与えら れたとき、自動的に検出可能であることは先の特 る)で記載された通りである。

またリレーションを利用する特徴点の一致検出 を目的とした照合方法には特願昭50-158757号明 細畵(特開昭52-82163号公報)及び特願昭50-る提案があるが、これらの方式で定義される運結 関係が紋様の変形に対し変動し易い点及び1特徴 点の連結関係の最大抽出数が不定であるためフア イル指紋の情報構成に難点があつた。

本発明の目的は、指紋等の照合に際して、指紋 30 紋様を特徴付ける各特徴点の位置X、Y及び方向 Dとともに各特徴点により固有に決定される局所 座標系を複数個の扇形領域に分割した近傍に於け る最近傍点と上記特徴点との隆線数即ちリレーシ い照合を可能にするものである。

次に実施例を参照して本発明の詳細を説明す る。第3図は、本発明の一実施例のブロック図を 示すものであり、それぞれフアイル指紋を記憶す 指紋特徴点を1指紋分づつ読取り一時記憶3に格 納するフアイル読取部2、一時記憶3に格納され た特徴点データによりリレーションを持いて最近 傍特徴点データを連結合成し、これが探索指紋の

ときは探索特徴記憶5へ、またフアイル指紋のと きはフアイル特徴記憶6に格納するリレーション 連結部 4、探索特徴記憶 5 及びフアイル特徴記憶 6とから「対」となるべき特徴点を位置、方向及 びリレーションによつて検査する「対」検査部 7、「対」であると判定された探索指紋特徴点と フアイル指紋特徴点のそれぞれを特徴点番号によ つてテーブル状に格納する「対」特徴記憶 8、及 び特徴点による照合を実行する照合判定部9とか

全体の動作は次のように説明される。外部の特 徴抽出装置(図には示さない)から探索指紋の特 徴点データは、フアイル装置1に一時記憶され信 号12を介してフアイル読取部2によつて読取ら び方向Dを記述する座標系とは関係なく決定され 15 れるか、又は直接フアイル読取部 2 に供給され、 いづれの場合にも信号22でアドレスされる一時 記憶3の記憶部分に信号21を介して格納され る。このときの一時記憶3の内容の内記述的デー タ301には人名、指種等の指紋固有示標、特徴 願昭54-39648号明細書(本願と同一出願人によ 20 点数等が示めされており信号33を介して照合判 定部9に送出される。照合判定部9は、探策すべ き指紋の記述的データ301を照合結果出力のた めに保持する。一方、一時記憶3の特徴点データ 302は第4図に示されるように特徴点種別Q、 158758号明細書(特開昭52-82164号公報)によ *25* 集密量C、位置X,Y方向D及び隆線数 r 、特徴 点番号mからなるリレーションRo, Ri, Ro, Ro を1特徴点として、複数(n+1)点分からなつ ており、これを信号31を介してリレーション連 結部4に出力する。リレーション連結部4は、第 5図に示される如く、第4図で例えばリレーショ ンR。の場合、特徴点番号m。をアドレス44に出 力し一時記憶3を読出して、M[®]を中心とする局 部座標系により位置x。, y。及び方向d。に変換し、 隆線数r。とともに探索特徴記憶5に信号41及び ョンを検査することにより安定で、かつ精度の高 35 アドレス 4 2 によつて格納する。位置xo, yoJ方 向doの紋様パターン上の意味は第1図に示した如 くである。他のリレーションR₁, R₂, R₂につい ても同様の処理が行われ、探索特徴記憶5に格納 される。特徴点データ302の全特徴点データに るフアイル装置 1、フアイル装置 1からフアイル 40 対して上記処理が施されると、第5図に示す形式 の特徴記述が探索特徴記憶5に完成する。リレー ションRo, Ri, Rz, Riは第1図に示した如く、 中心特徴点Mに関する局所座標系の各象限に於け る風形領域の最近傍符徽点mo, mi, m2, m,に

よつて決定される。中心特徴点Mに対するリレー ションは上記局所座標系に於いてこれを複数角に 分割する扇形領域の各領域に 1 づつ定義されるも ので、本発明は各象限即ち4角に分割する実施例 について説明するが、以下に説明する内容から他 5 の分割数の実施も容易に理解できるところであ る。

以上のようにして、探索特徴記憶5への探索特 **徴データの格納が終了すると、フアイル読取部 2** 1から信号21を介してフアイル・アドレス23 を制御することにより順次読出し、探索指紋の場 合と同様にしてリレーション連結を行いその結果 を信号41アドレス43によつて、フアイル特徴 データがフアイル特徴記憶 B に格納される毎に、 探索特徴データ及びフアイル特徴データは「対」 検査部7で、その特徴点の全ての組合せが信号 5 1,81を介して読出され、それぞれ、位置、方 閾値内である場合のみ、第6図で示される如くそ の特徴点番号「対」M³, M⁸が信号71、アドレ ス72によつて「対」特徴記憶8に書込まれる。 この場合、探索指紋特徴点M⁵、フアイル指紋特 徴点M'を示す。

照合判定部のはアドレス91によつて「対」特 徴記憶8から信号81を介して探索指紋及びフア イル指紋の特徴点番号「対」を得、これに基づく アドレス82,83によつて探索特徴記憶5及び 出し、2つの指紋の一致性を照合判定する。フア イル指紋1指の照合判定が終了すると信号90を 介して次のフアイル指紋の読取りがフアイル読取 装置2によつて開始せられ、読取られるべき全て のフアイル指紋の読取りが終了したとき探索指紋 35 の照合判定が完結する。

各処理部はその動作開始終了を互に連結し同期 をとるために信号20,40,70及び90によ つて連結されている。

要を示したが、これら各処理部の内フアイル装置 1、フアイル読取部2については当業者がすでに **衆知である適当な磁気デイスク装置、あるいは磁** 気テープ装置等で良く、説明を娶しない。

次に第7図を参照してリレーション連結部4の 一実施例について説明しよう。

第7図を参照してリレーション連結部4はシフ トレジスタ401、X, Y, D-レジスタ402 X, Y, D、加算器 4 0 7 X、減算器 4 0 3 X, Y, D及び407Y、乗算器405X, Y、40 6 X, Y、円関数発生器 4 0 4 及び制御回路 4 0 0で構成されており、次のように動作を行う。

一時記憶3のまづ第1の特徴点即ち、第4図 は、照合すべき第一の特徴データをフアイル装置 10 Mºの特徴点データが信号31を介してシフトレ ジスタ**40**1にR₀, R₁, R₂, R₁, X, Y, D— レジスタ402X, Y, DにそれぞれX, Y, D がセツト信号4001によつてセツトされる。同 時に、この内のQ, C, X, Y, Dのみは信号4 記憶8に格納する。順次読出されるフアイル特徴 15 1を介して、アドレス42によつて指定される探 案特徴記憶5又はフアイル特徴記憶6の第5図で 示されるQ, C, X, Y, Dに書込される。また Qは信号4000を介して制御回路400に入力 され、特徴点であることが確認された後、シフト 向、リレーションの「対」検査で予め定められた 20 レジスタ401の左端から信号4011によつて 第1のリレーション特徴点番号moを入力し、こ れによつてアドレス44を出力し、その特徴点デ ータを信号31を介して読出す。読出されたリレ ーション特徴点データのうちX、Y、Dは、X、 25 Y, D-レジスタ402X, Y, Dの内容即ち中 心特徴点MºのX, Y, Dと、直ちに減算器40 3X, Y, Dでその差AX、AY、ADが算出さ れ、一方D一レジスタの内容によつて、例えば ROM(リードオンリメモリ) で構成される円関 フアイル特徴記憶 6 から必要な特徴点データを読 30 数発生器 4 0 4 は、その出力 4 0 4 1 , 4 0 4 2 に円関数値cosD、sinDを発生する。 4 つの乗算 器 4 0 5 X, Y 4 0 6 X, Y及び加減算器 4 0 7X. Yにより

$x_0 = \Delta X \cos D + \Delta Y \sin D$ $y_0 = \Delta Y \cos D - \Delta X \sin D$

なる座標変換出力xo,yoが加算器407X、減算 器407Yから、又減算器403Dの出力として 方向doが得られ、シフトレジスタ401の左端に 信号4012によつて出力されているかとともに 以上でブロツク図第3図によつて照合動作の概 40 第1のリレーション連結データro, xo, yo, doと して信号41を介して探索特徴記憶5又はフアイ ル特徴記憶8にアドレス42で指定される位置に 書込まれる。第1のリレーションR₀の動作が終 了すると制御回路400はシフトパルス4002

をシフトレジスタ401に入力し、次の第2のり レーションRiを左端に出力させ、上述の動作を 繰返えす。第4のリレーションR₃の処理が終了 すると第5図の第1の特徴点Mºが完成したこと ション連結処理が終了すると制御回路400は信 号40によつて動作終了を「対」検出部7に出力。 し全ての動作を終了する。

制御回路40の構成は上記動作説明によつて当 業者に容易に実現できるもので詳細を省略する。

次に第8図を用いて「対」検出部7の詳細につ いて説明する。「対」検出部7は制御回路700、 絶対値減算器701R, X, Y, D、比較器70 2 R, X, Y, D及び708 閾値発生器703、 Q7、及びANDゲート708から構成されてお り、次のような動作を行う。

リレーション連結部 4 からのフアイル特徴記憶 5への格納動作終了信号 4 0 を制御回路 7 0 0 が 探索特徴記憶5、フアイル特徴記憶8に出力し第 1の特徴点データ即ち第5図のM°のC、X、Y、 Dを探索/フアイルそれぞれから信号51,61 を介して読出し絶対値減算器 701R, X, Y, D及び比較器 702R, X, Y, Dによつて $|C^s-C^r| \leq T_0, |X^s-X^r| \leq T_x,$ $\mid Y^s - Y^F \mid \leq T_{y_s} \mid D^s - D^F \mid \leq T_{D}$

> (Sは探案特徴記憶出力、Fはフアイル特 徴記憶出力を表わす。)

に供給される。この比較の閾値T。, Tx, Ty, To は閾値発生器703から供給される。上記全ての 比較が真のときのみANDゲート706の出力7 0 8 0 がONとなり制御回路700は、次に述べ OFFのときは、次のフアイル特徴点の読出しを 行う。リレーション比較を行う場合には、制御回 路700はリセット信号7001を出力しカウン タ705,707を初期化するとともに、アドレ アイル特徴配憶 8 から第1のリレーションro, xo, yo, doをそれぞれ読出し上記C, X, Y, D と同様にして絶対値減算器701R,X,Y,D 及び比較器 7 0 2 R, X, Y, Dによって

 $|r^s-r^r| \leq T_r, |x^s-x^r| \leq T_x,$ $|y^s-y^r| \leq T_{y_1} |d^s-d^r| \leq T_a$ を検査する。これら全比較が真のときANDゲー ト706はON信号7060を出力し、制御回路 になる。この動作を繰返し、特徴点Mⁿのリレー 5 700は、カウント信号7002を出力しカウン タ707を更新する。

たゞし、上記比較判定に先だつてご、ごが読出 された時点で隆線数コード検出器704はピ,ご のいづれかにリレーションが存在しない場合に設 10 定されているコードを検出しもし不在リレーショ ンがら、どのいづれかに検出された場合はその結 果を信号7040を介して制御回路700に出力 するとともにカウンタ705を更新する。この場 合制御回路 7 0 0 は先の比較判定の結果に拘らず 隆線数コード検出器704、カウンタ705,7 15 カウント信号7002を出力しない。以上の動作 を第2~第4リレーション・データについて繰返 えす。第4のリレーション・データの処理が終了 すると制御回路700はカウンタ707の出力 を、カウンタ705の出力即ち、不在リレーショ 受けとると直ちにアドレス73,74をそれぞれ 20 ン数によつて決定される閾値7030と比較器7 08で比較しその出力7080がONのとき内部 保持している探索特徴点番号M[®]及びフアイル特 徴点番号M[®]を信号71を介して「対」特徴記憶 8にアドレス 7 2 とともに出力する。一対の処理 25 が終了すると制御回路 7 0 0 はアドレス 7 4 を 更 新して、次のフアイル特徴点を読出し、また全フ アイル特徴点の読出しが終了するとアドレス73 を更新して次の探索特徴点を読出し、上記処理を 全探索及びフアイル特徴点「対」に対して行う。 が検査され、その比較出力がANDゲート706 30 以上の結果として第8図の示した「対」特徴記憶 8の内容が完成する。

関値発生器 703はそれぞれ上記動作で説明し た比較に必要な閾値を必要な時点で制御回路70 0の制御信号7003のもとに出力するコード発 るリレーション比較に入る。もし出力7080が 35 生器例えばROMでよく、また隆線コード検出器 704は単純な一致比較回路を組合せたものでよ い。制御回路700の構成は上記動作説明により 当業者に容易になし得るので詳細は省略する。

以上で本発明の主要部分について説明を終了し ス73,74を変更して、探索特徴記憶5及びフ 40 たが、照合判定部9については種々の照合判定装 置が考えられる。例えば特開昭50-55232号公報、 特開昭50-132838号公報あるいは特開昭53-12235号公報等の装置が使用できるがいづれに於 いても、特徴点の対を全組合せで検査するのでは

10

なく、「対」特徴記憶8に蓄積された探案特徴点 MS及びフアイル特徴点MFの組合せのみを照合判 定の入力とすることにより誤つた「対」を照合判 定の入力から削除することが可能となり、精度の 高い照合結果が得られる。

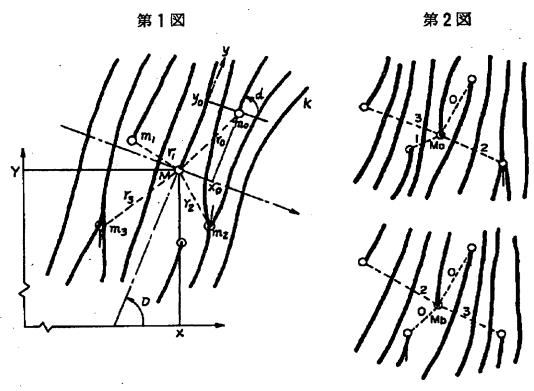
9

図面の簡単な説明

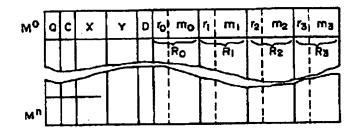
第1図は、指紋の特徴点及びリレーションの定 義を説明する図、第2図は特徴点の位置及び方向 が同一であつてもリレーションで異なる指紋であ 本発明の装置のブロツクを示す図、第4図は一時

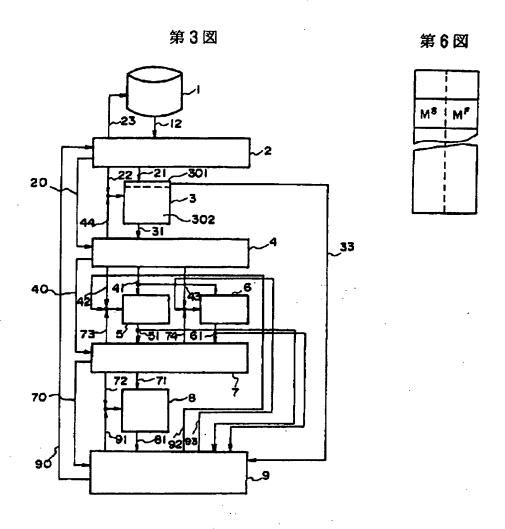
記憶3の内容を、第5図は探索及びフアイル特徴 記憶5, 8の内容を、第6図は「対」特徴記憶8 の内容を説明する図、第7図はリレーション連結 部4の詳細を説明するブロック図、第8図は 5 「対」検出部7の詳細を説明するブロック図であ る。

図において、1はフアイル装置、2はフアイル 読取部、3は一時記憶、4はリレーション連結 部、5は探索特徴記憶、8はフアイル特徴記憶、 ることが判定できることを説明する図、第3図は 10 7は「対」検出部、8は「対」特徴記憶、9は照 合判定部をそれぞれ示す。



第4図





第5図

